

UAB „ARM GATE“

Įmonės kodas 135218757, PVM mokėtojo kodas LT352187515,
adresas J.Kubiliaus g. 6-21, LT – 08234 Vilnius
Įmonė įregistruota VĮ Registrų centro Kauno filiale, Registravimo Nr. 037947

Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL WDXRF SPEKTROMETRO PIRKIMO**

(Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją.
Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas)

2022 10 23 **KP9488**
Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių ¹ pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Arm Gate“, į.k. 135218757
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė</i>)	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Žydrūnas Stanius, tel. 861416157, zydrunas@armgate.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.*)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į Konkurso sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			
2.			

3.			
----	--	--	--

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		
3.		

4. MES SIŪLOME:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Tiekėjo siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas	1 vnt. kaina, Eur, be PVM, (du skaičiai po kablelio)*
1	2	3	4	5	6
1.	WDXRF spektrometras	vnt.	1	ZSX Primus IVi (Rigaku Corporation, japonija)	229 700 ,00
PVM tarifas, proc.					21
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)*:					48 237,00
Iš viso kaina Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio)*:					277 937,00

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais ir skaičiais): du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 0 ct

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

* Kainos pateikiamos nurodant 2 skaičius po kablelio (antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5).

5. Mes įsipareigojame pateikti Konkurso sąlygų 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus atitinkančią prekę. Siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas) nustatytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>)
1.	2.	3.	4.
1.	Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis	Nurodyti spektrometro gamintoją, įvardinti pavadinimą ir siūlomą modelį	Rigaku Corporation. ZSX Primus IVi
2.	Kilmės šalis	Nurodyti spektrometro kilmės šalį	Japonija
3.	Paskirtis	Rentgeno spindulių spektrometras kietų, miltelinių, skystų bandinių kokybinės, pusiau-kiekybinės bei kiekybinės elementinės sudėties analizei.	Rentgeno spindulių spektrometras kietų, miltelinių, skystų bandinių kokybinei, pusiau-kiekybinei ir kiekybinei elementinės sudėties analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf</i>
4.	Tipas	Rentgeno spindulių fluorescencijos, pagrįstos bangos ilgio dispersija, spektrometras.	Rentgeno spindulių fluorescencijos, pagrįstos bangos ilgio dispersija, spektrometras <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i>
	Generatorius	1. generatoriaus galia ne mažesnė kaip 4 kW.	4 kW <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.1 (2))</i>
		2. generatoriaus įtampa ne mažesnė kaip 60 kV	60 kV <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.1 (1), (4))</i>
		3. įtampos keitimo žingsnis ne didesnis kaip 1 kV	1 kV

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>)
1.	2.	3.	4.
			Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.1 (4))
		4. generatoriaus srovė ne mažesnė kaip 150 mA	150 mA Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.1 (1), (4))
		5. srovės keitimo žingsnis ne didesnis kaip 1 mA	1 mA Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.1 (4))
6.	Rentgeno vamzdis	1. Anodo medžiaga Rh (Rodis)	Rh (Rodis) Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.2)
		2. vamzdžio galia ne mažesnė kaip 4 kW	4 kW Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.2)
		3. Be langelio storis ne didesnis kaip 30 μm	30 μm Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (X-RAY TUBE)
		4. Padėtis bandinio atžvilgiu – po bandiniu	Rentgeno vamzdis po bandiniu (angl. „tube below“) Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)
7..	Analizinių kristalų laikiklis	automatinis ir dvikryptis.	Automatinis ir dvikryptis

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
			<i>Primus_IVi_specification.pdf – p.9 (3.2.7)</i>
8.	Su įranga pridedamų analizinių kristalų rinkinys	1. kiekybinei ir kokybinei analizei elementų diapazonui, ne siauresniam kaip nuo Be iki Cm, įskaitant:	Komplektacijoje pridedamas analizinių kristalų rinkinys analizei elementų nuo Be iki Cm. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i>
		1.1. išlenktą Ge kristalą (elementų diapazonui, ne prastesniam kaip nuo P iki Sc);	Pridedamas išlenktas Ge kristalas (GeH) elementų nuo P iki Sc analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.2. išlenktą PET kristalą (elementų diapazonui, ne prastesniam kaip nuo Al iki Sc);	Pridedamas išlenktas PET kristalas (PETH) elementų nuo Al iki Sc analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.3. Kristalą elementų diapazonui, ne prastesniam kaip nuo O iki Mg;	Pridedamas kristalas RX26 elementų nuo O iki Mg analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
		1.4. Kristalą elementų diapazonui, ne prastesniam kaip nuo K iki Cm;	Pridedamas kristalas LiF(200) elementų nuo K iki Cm analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.5. kristalą N ir O analizei;	Pridedamas kristalas RX40 elementų N ir O analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.6. kristalą C analizei;	Pridedamas kristalas RX61F elemento C analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.7. kristalą didelio jautrumo analizei elementų diapazonui nuo O iki Mg;	Pridedamas kristalas RX35 elementų nuo O iki Mg didelio jautrumo analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.8. kristalą didelės skiriamosios gebos analizei elementų diapazonui nuo Cr iki Cm;	Pridedamas kristalas LiF(220) elementų nuo Cr iki Cm didelės skiriamosios gebos analizei.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
			<i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.9. kristalą didelio jautrumo analizei elementams nuo P iki Cl;	Pridedamas kristalas RX9 elementų nuo P iki Cl didelio jautrumo analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
		1.10. kristalą didelio jautrumo analizei elementams Be ir B.	Pridedamas kristalas RX85 elementų Be ir B didelio jautrumo analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.6 (pav. prie CRYSTAL)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.10 (3.2.8)</i>
9.	Automatizuotas pirminės rentgeno spinduliuotės filtrų rinkinys	Privalomas, ne mažiau 4 vnt.,	Automatizuotas pirminės rentgeno spinduliuotės filtrų rinkinys, 4 vnt.: <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.3)</i>
		Rh-K α spinduliuotės sugėrimui;	Ni400 Rh-K α spinduliuotės sugėrimui. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.3)</i>
		Rh-L α sugėrimui;	Al25 Rh-L α spinduliuotės sugėrimui

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
			<i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.3)</i>
		Pb-L α , As-K α matavimams;	Ni40 Pb-L α , As-K α matavimams. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.3)</i>
		Cr, Co, Fe, Zn analizei.	Al125 Ti, Cr, Co, Fe, Zn analizei. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.3)</i>
10.	Rentgeno spindulių vamzdį nuo bandinio apsauganti sistema (tiriant birius mėginius turi būti užtikrinta galimybė naudoti apsauginį berilio filtrą, kuris yra būtinas).	privalomas	Pridedamas apsauginis berilio (Be30) filtras rentgeno vamzdžio apsaugai nuo birių bandinių. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.3)</i>
11.	Privalomas automatinis diafragmų rinkinys	ne mažiau kaip 6 skirtingų diametrų.	Automatinis diafragmų rinkinys, 6 skirtingų diametrų: <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.9 (3.2.4)</i>
		Diafragmų diametrų diapazonas: nuo ne didesnių	Diafragmų diametrų diapazonas nuo 1mm iki 35mm (1, 3, 10, 20, 30, 35 mm)

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
		kaip 1mm iki ne mažesnių kaip 35mm.	<i>Primus_IVi_specification.pdf – p.4 (2.2.3)</i>
12.	Kolimuojantys (Soller) plyšiai	Privalomi rentgeno spinduliuotę kolimuojantys plyšiai fiksuoti kiekvienam spektrometro detektoriui;	Pridedami kolimuojantys (angl. „soller“) plyšiai fiksuoti kiekvienam spektrometro detektoriui. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.9 (3.2.5)</i>
		Privalomi papildomi rentgeno spinduliuotę kolimuojantys plyšiai, keičiami programinės įrangos pagalba, bent 3 skirtingų dydžių.	Pridedami papildomi rentgeno spinduliuotę kolimuojantys plyšiai (angl. „divergence slit“), keičiami programinės įrangos pagalba, 3 skirtingų dydžių: standartinės skiriamosios gebos (angl. „standard resolution“), aukštos skiriamosios gebos (angl. „fine resolution“) ir ultra lengviems elementams (angl. „ultra-light element“) <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.9 (3.2.5)</i>
13.	Rentgeno spindulių slopintuvas (angl. „attenuator“):	privalomas	Pridedamas rentgeno spindulių slopintuvas (angl. „attenuator“). <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.9 (3.2.4)</i>
14.	Detektorius sunkiems elementams	Privalomas scintiliacinis, gebantis registruoti elementų rentgeno spinduliuotę, ne siauresnio diapazono kaip nuo Ti iki Cm.	Pridedamas scintiliacinis detektorius sunkiems elementams, gebantis registruoti elementų rentgeno spinduliuotę nuo Ti iki Cm. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i>

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
			<i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.9)</i>
15.	Detektorius lengviems elementams	Privalomas proporcinis, gebantis registruoti elementų rentgeno spinduliuotę, ne siauresnio diapazono kaip nuo Be iki Ni.	Pridedamas proporcinis detektorius lengviems elementams, gebantis registruoti elementų rentgeno spinduliuotę nuo Be iki Ni. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.9)</i>
16.	Daugiakanalis analizatorius (angl. „MCA“)	privalomas	Pridedamas daugiakanalis analizatorius (MCA). <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.7 (D-MCA HIGH SPEED ANALYSIS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (3.3.1)</i>
17.	Proporcinio detektoriaus dujų tankio stabilizavimas	privalomas	Yra proporcinio detektoriaus dujų tankio stabilizavimas. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.9 (2))</i>
18.	Proporcinio detektoriaus anodo valymo sistema	privaloma	Yra proporcinio detektoriaus anodo (angl „center wire“) valymo sistema. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.9 (2))</i>
19.	Korekcijos	privaloma skaičiavimo korekcija; automatinė nuostolių	Yra automatinė skaičiavimo nuostolių korekcija. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (3.3.3 (2))</i>

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
		Privaloma automatinė impulsų aukščio pokyčio korekcija (angl. „Pulse height shift“);	Yra automatinė impulso aukščio pokyčio (angl. „pulse height shift“) korekcija. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (3.3.3 (2))</i>
20.	Analizuotinų bandinių skaičius saugojimo vietoje	ne mažiau kaip 60	Analizuotinų bandinių skaičius saugojimo vietoje – 60 vnt. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.1)</i>
21.	Bandinių, vienu metu talpinamų analizės kameroje, skaičius	Ne mažiau kaip 2	Vienu metu analizės kameroje talpinamų bandinių skaičius – 2. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.2)</i>
22.	Automatinis bandinio paėmimas ir pernešimas į/iš bandinio saugojimo vietos į/iš analizės vietos.	Privalomas	Automatinis bandinio paėmimas ir pernešimas į/iš bandinio saugojimo vietos į/iš analizės vietos (angl. „automatic sample changer with X-Y transfer mechanism“) <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.1)</i>
23.	Bandinio sukimo funkcija analizės metu	privaloma	Yra bandinio sukimo funkcija analizės metu. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.2)</i>
24.	Darbo nepertraukiamumas bandinio įvedimo į analizės kamerą metu	Privalo būti užtikrinta, kad viso bandinio įvedimo ir išnešimo į/iš analizės kamerą metu rentgeno spindulių	Rentgeno spindulių generavimas nėra sustabdomas bandinio įvedimo ir išnešimo į/iš analizės kameros metu. Ši funkcija užtikrinama galimybe vienu metu analizės kameroje laikyti 2 bandinius,

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai. <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
		generavimas sustabdytas.	nebūtų iš kurių vienas gali būti vakuumuojamas (prieš patalpinant jį į analizės vietą), kol kitas bandinys tuo metu yra analizuojamas. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.2 (12)</i>
25.	Sukuriama atmosfera analizės kameroje (privaloma)	vakuumo	Yra vakuumo sukūrimo analizės kameroje funkcija. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.13)</i>
		helio dujų	Yra helio dujų atmosferos sukūrimo analizės kameroje funkcija. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.16)</i>
26.	Sistema, izoliuojanti optinių elementų (kristalų) kamerą ir išlaikanti joje vakuumo atmosferą, kai analizės kameroje naudojamos He dujos	Privaloma.	Yra sistema, izoliuojanti optinių elementų (kristalų) kamerą ir išlaikanti joje vakuumo atmosferą, kai analizės kameroje naudojamos He dujos (angl. „partition“) <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.9 (VACUUM PARTITION SYSTEM FOR ANALYZING LIQUIDS)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.8 (3.2.2)</i>
27.	vakuuminis siurblys, užtikrinantis vakuumo generavimą ir palaikymą analizės ir	komplektacijoje privalomas.	Pridedamas vakuuminis rotacinis siurblys, užtikrinantis vakuumo generavimą ir palaikymą analizės ir optinių elementų kamerose.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.)</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
	optinių elementų kameroje		<i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.13)</i>
28.	Automatinė pasirinkto ir nustatyto vakuumo lygio analizės kameroje palaikymo sistema	Privaloma.	Yra automatinė pasirinkto ir nustatyto vakuumo lygio analizės kameroje palaikymo sistema (angl. “APC - automatic pressure control”). <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.7 (APC (AUTOMATIC PRESSURE CONTROL))</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.2 (10)</i>
29.	Temperatūros stabilizavimo sistema	Optinių elementų kameroje privalo būti palaikoma ir užtikrinama pastovi temperatūra atskiro nuo rentgeno vamzdžio šildytuvo.	Yra pastovios temperatūros optinių elementų kameroje stabilizavimo sistema, kuri yra atskira nuo rentgeno vamzdžio. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.15)</i>
30.	Kietų ir skystų bandinių laikikliai	ne mažiau 60 vienetų	Pridedami 60 vnt. kietų ir skystų bandinių laikikliai. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (SPECIFICATIONS)</i>
		Bandinių laikikliai privalo būti su skirtingų diametrų angomis, atidengiančiomis bandinio paviršių analizei. Angų diametras: nuo ne didesnio kaip 5mm iki ne mažesnio kaip 38 mm.	Pridedami laikikliai su skirtingų diametrų angomis, kurių diametras nuo 5 mm iki 38 mm (5mm, 10mm, 20mm, 27mm, 30mm, 38mm). <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.11 (3.2.17 (2))</i>
		Privalo būti pridėti įvairių diametrų centruojantys žiedai, palengvinantys skirtingų diametrų bandinių	Bus pridėti įvairių diametrų centruojantys žiedai, 77 vnt.:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
		pozicionavimą bandinių laikikliuose, ne mažiau 60 vnt. (Resin center ring, ID=44mm for 38mm mask – 2vnt. Resin center ring, ID=40mm – 5vnt., Resin center ring, ID=36mm for 30mm mask – 30vnt. Resin center ring, ID=32mm for Chemplex 1530 and 27mm mask – 30vnt. Resin center ring, ID=26mm for 20mm mask – 5vnt. Resin center ring, ID=16mm for 10mm mask – 5vnt. Centravimo žiedų dydžiai gali skirtis atitinkamai pagal gamintojo naudojamas diafragmas)	Resin center ring, ID=44mm for 38mm mask – 2 vnt. Resin center ring, ID=40mm – 5 vnt. Resin center ring, ID=36mm for 30mm mask – 30 vnt. Resin center ring, ID=32mm for Chemplex 1530 and 27mm mask – 30 vnt. Resin center ring, ID=26mm for 20mm mask – 5 vnt. Resin center ring, ID=16mm for 10mm mask – 5 vnt.
31.	Polietileno indeliai skystų ar birių bandinių analizei	Privalomi, ne mažiau 100 vnt.	Bus pridėti polietileno indeliai skystų ar birių bandinių analizei, 100 vnt.
32.	Poliesterio plėvelė skystų ir birių bandinių paruošimui analizei	Privaloma, ne mažiau 100 vnt. bandinių analizei.	Bus pridėta poliesterio plėvelė skystų ir birių bandinių paruošimui analizei, 100 vnt. bandinių analizei.
33.	Polipropileno plėvelė skystų ir birių bandinių paruošimui analizei	Privaloma, ne mažiau 100 vnt. bandinių analizei.	Bus pridėta polipropileno plėvelė skystų ir birių bandinių paruošimui analizei, 100 vnt. bandinių analizei.
34.	Gamintojo reikalavimus atitinkantis PK su monitoriumi, klaviatūra bei pele	Privalomas.	Pridedamas gamintojo reikalavimus atitinkantis PK su monitoriumi, klaviatūra, pele įrenginio kontrolei, duomenų surinkimui ir analizei.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
	įrenginio kontrolei, duomenų surinkimui ir analizei		<i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (3.4.1)</i>
35.	PK operacinė sistema	Windows arba lygiavertė	PK operacinė Sistema Windows. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (3.4.1)</i>
36.	Programinė įranga įrenginio kontrolei, duomenų surinkimui ir analizei	Privaloma	Pridedama programinė įranga (ZSX Guidance) įrenginio kontrolei, duomenų surinkimui ir analizei. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (4.1)</i>
37.	Kokybinė ir kiekybinė bandinio analizės funkcija	Privaloma.	Yra kokybinės ir kiekybinės bandinio analizės funkcija. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.13 (4.1.4, 4.1.5)</i>
38.	Nežinomų bandinių kiekybinė analizė be kalibracinių standartų (pusiau kiekybinė arba bestandartė analizė, angl. „standardless analysis“) naudojant fundamentalių parametrų (FP) metodiką.	Privaloma.	Pridedama nežinomų bandinių kiekybinė analizė be kalibracinių standartų (pusiau kiekybinė (vad. bestandartė) analizė naudojant fundamentalių parametrų (FP) metodiką (angl. “Standard-less FP analysis”, „Scan Quant X (SQX)“). <i>SoftwareOption_specification.pdf – p.2 (2.1)</i>
39.	Bestandartės analizės korekcijos funkcijos	privaloma	Yra bestandartės analizės korekcijos funkcijos.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
			SoftwareOption_specification.pdf – p.3 (2.1)
40.	Bandinio paruošimui naudotos plėvelės įtakos	privaloma	Yra bandinio paruošimui naudotos plėvelės įtakos korekcijos funkcija (angl. „sample film“). SoftwareOption_specification.pdf – p.3 (2.1)
41.	Atmosferos, esančios analizės kameroje, įtakos	privaloma	Yra atmosferos, esančios analizės kameroje, įtakos korekcijos funkcija (angl. „Helium atmosphere“). SoftwareOption_specification.pdf – p.3 (2.1)
42.	Bandinio priemaišų įtakos	privaloma	Yra bandinio priemaišų įtakos korekcijos funkcija (angl. „impurity“). SoftwareOption_specification.pdf – p.3 (2.1)
43.	Kiekybinės analizės rezultatų perskaičiavimas pakeitus kalibracijos ir kt. parametrus.	Privalomas.	Yra kiekybinės analizės rezultatų perskaičiavimo funkcija, pakeitus kalibracijos ir kt. parametrus. Primus_IVi_specification.pdf – p.1 (4) Primus_IVi_brochure.pdf – p.9 (SUPERIOR DATA HANDLING)
44.	Automatinis matavimo sąlygų nustatymas kuriant analizės metodą	Privalomas.	Yra automatinis matavimo sąlygų nustatymas kuriant analizės metodą. Primus_IVi_brochure.pdf – p.11 (OMATIC QUANT APPLICATION SETUP)

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
			<i>Primus_IVi_specification.pdf – p.1 (1)</i>
45.	Atliekant bestandartę bandinio analizę, nematuotinių/neanalizuotinių bandinio komponentų įtakos įvertinimas, panaudojant rentgeno šaltinio spinduliuotės sklaidą bandinyje.	Privalomas.	Yra funkcija, suteikianti galimybę įvertinti nematuotinių/neanalizuotinių bandinio komponentų įtaką bestandartinėje analizėje, panaudojant rentgeno šaltinio spinduliuotės bandinyje sklaidą (angl. „SQX Scattering FP Method“). <i>SoftwareOption_specification.pdf – p.5 (2.3)</i>
46.	Atskiros, galimos kurti naudotojo, įrenginio jautrumo (intensyvumo) verčių bibliotekos (duomenų bazės) nežinomiems bandiniams, panaudojant nežinomiems bandiniams artimus („etaloninius“) bandinius (tiksliesiems pusiau kiekybinės analizės rezultatams).	Privaloma	Yra funkcija, suteikianti galimybę naudotojui kurti atskiras įrenginio jautrumo verčių bibliotekas nežinomiems bandiniams, naudojant nežinomiems bandiniams artimus bandinius (angl. „Matching Library“). <i>SoftwareOption_specification.pdf – p.5 (2.2)</i> <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.6 (2.5.13)</i>
47.	Papildoma jautrumo biblioteka plienų analizei	Privaloma	Pridedama papildoma jautrumo biblioteka plienų analizei (angl. „Tool steel and high-speed steel“, „Low alloy steel and stainless steel“). <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.16 (4.2.3 (2) – b, c)</i>

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas <i>(Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</i> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
48.	Automatinio rentgeno spindulių šaltinio galios didinimo (angl. „tube aging“) funkcija	Privaloma	Yra automatinė rentgeno spindulių šaltinio galios didinimo funkcija (angl. “automatic aging”). <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.1 (7))</i>
49.	Automatinė rentgeno šaltinio įtampos ir srovės sumažinimo funkcija, neatliekant matavimų (energijos taupymo funkcija)	Privaloma	Yra automatinė rentgeno spindulių šaltinio įtampos ir srovės sumažinimo funkcija, neatliekant matavimų (energijos taupymo funkcija). <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.3 (25)</i> <i>SoftwareOption_specification.pdf – p.11 (2.9)</i>
50.	Automatinė rentgeno šaltinio išjungimo funkcija sekos pabaigoje	Privaloma	Yra automatinė rentgeno šaltinio išjungimo funkcija matavimų sekos pabaigoje. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.3 (25)</i> <i>SoftwareOption_specification.pdf – p.11 (2.9)</i>
51.	Analizės ir analizės sekos pradėjimo nustatyto fiksuoto (vėlesniu) laiku funkcija.	Privaloma	Yra analizės ir analizės sekos pradėjimo nustatyto fiksuoto (vėlesniu) laiku funkcija. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.3 (25)</i> <i>SoftwareOption_specification.pdf – p.11 (2.9)</i>
52.	Aušinimo sistema, užtikrinanti spektrometro rentgeno šaltinio aušinimą	Privaloma komplektacijoje	Komplektacijoje pridedama aušinimo sistema, užtikrinanti spektrometro rentgeno šaltinio aušinimą. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.3 (1))</i>

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (<u>Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai.</u> <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
53.	Saugumui užtikrinti, sistemos funkcija fiksuoti ir informuoti apie: netinkamą aušinimo sistemos temperatūrą, tėkmę, slėgį, vandens lygį.	Privaloma.	Yra sistemos funkcija, fiksuojanti ir informuojanti apie: netinkamą aušinimo sistemos temperatūrą, tėkmę, slėgį, vandens lygį. <i>Primus_IVi_specification.pdf – p.7 (3.1.3 (1))</i>
54.	Spektrometro elektros maitinimo parametrai	Privaloma vienos fazės, kintamos įtampos, 220V, 50Hz.	Spektrometro elektros maitinimas – vienos fazės, kintamos įtampos, 220V, 50Hz. <i>Primus_IVi_brochure.pdf – p.15 (INSTALLATION SPECIFICATIONS)</i>
55.	Sistemos su visais priedais pristatymas ir instaliavimas pirkėjo nurodytu adresu.	Privalomas.	Tiekėjas įsipareigoja pristatyti bei instaliuoti sistemą su visais priedais pirkėjo nurodytu adresu.
56.	Pirkėjo mokymai ir supažindinimas su įrangos darbu, funkcijomis, darbo tvarka po instaliacijos.	Privaloma	Tiekėjas įsipareigoja pirkėją supažindinti ir apmokyti darbui su įranga, funkcijomis, darbo tvarka po instaliacijos.
57.	Kvalifikuotos techninės, metodologinės pagalbos suteikimas, vartotojų konsultacijos, įrangos sutrikimų diagnostika, įrangos darbingumo atstatymas, esant poreikiui	Privaloma.	Tiekėjas įsipareigoja suteikti kvalifikuotą techninę, metodologinę pagalbą naudotojui bei konsultuoti, atlikti įrangos diagnostikos, darbingumo atstatymo darbus, esant poreikiui.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)	Atitikimo reikalavimams pagrindimas (Pildo tiekėjas. Turi būti nurodyti prašomi duomenys ar parametrai). <i>Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1.	2.	3.	4.
58.	Aplinkos apsaugos sistemų taikymas įrangos gamyboje	Įrangos gamintojas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitus tiekėjo pateiktus lygiaverčius įrodymus (SERTIFIKATAS PATEIKIAMAS SU PASIŪLYMU)	Įrangos gamintojas Rigaku taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą ISO 14001:2015 ir atitinka šiuo punktu keliamus reikalavimus. Reikalinga informacija apie Sertifikatą pateikiamas su pasiūlymu. <i>Rigaku eco_policy.pdf</i> Daugiau informacijos apie Rigaku ISO14001 sertifikatus pagal nuorodas: https://www.certipedia.com/quality_marks/9105040952?locale=en https://www.certipedia.com/quality_marks/9105040952/system_certificates?certificate_type=ISO+14001&locale=en
59	Garantija	Įrangai turi būti suteikiama: ne mažiau kaip 1 metų garantija spektrometrui; ne mažiau kaip 3 metų garantija rentgeno vamzdžiui.	Įrangai suteikiama garantija: spektrometrui – 1 metai, rentgeno vamzdžiui – 3 metai.

Kartu su pasiūlymu teikiame užpildytą Tiekėjo deklaraciją (Konkurso sąlygų 5 priedas).

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su Konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- Konkurso sąlygose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja Konkurso sąlygų VI skyriuje 6.12 punkte nurodytą terminą.

Direktorius*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**(Parašas)***Žydrūnas Stanius***(Vardas, pavardė)*